05.4;12

Диэлектрические свойства планарных структур на основе сегнетоэлектрических пленок Ba_{0.5}Sr_{0.5}TiO₃

© Б.М. Гольцман, В.В. Леманов, А.И. Дедык, С.Ф. Карманенко, Л.Т. Тер-Мартиросян

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург Петербургский государственный электротехнический университет

Поступило в Редакцию 7 апреля 1997 г.

Экспериментально исследованы диэлектрические свойства планарных структур Cu–Cr/Ba_{0.5}Sr_{0.5}TiO_3 и YBa_2Cu_3O_{7-\delta}/Ba_{0.5}Sr_{0.5}TiO_3 в интервале темератур 78–300 К.

Показано, что использование электродов из YBCO в структурах на основе пленок $Ba_{0.5}Sr_{0.5}TiO_3$ обеспечивает отсутствие диэлектрического гистерезиса в параэлектрической фазе при сохранении диэлектрической нелинейности и к снижению уровня диэлектрических потерь.

Работа посвящена сравнительному исследованию диэлектрических свойств планарных структур на основе поликристаллических пленок состава $Ba_{0.5}Sr_{0.5}TiO_3$ (BST) с электродами из металлов Cu–Cr, Ni и из окисного высокотемпературного сверхпроводника $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ (YBCO).

Сегнетоэлектрические пленки BST были получены на подложке α -Al₂O₃ методом BЧ магнетронного распыления в атмосфере аргона и кислорода с последующим отжигом в кислороде при температуре 1150°C [1]. Толщина пленок была в пределах 1–1.2 μ m. Пленки имели поликристаллическую структуру.

Металлические электроды наносились методом термического испарения в вакууме. Электроды из высокотемпературного сверхпроводника наносились методом магнетронного распыления на постоянном токе. Толщина пленок YBCO составляла 0.4 µm, температура перехода лежала в пределах (83–90) К, ширина перехода не превышала (1–2) К. Контакты к электродам из YBCO наносились термическим испарением Ад в вакууме. Планарные электроды формировались с

46



Рис. 1. Температурные зависимости емкости планарных структур на основе пленок $Ba_{0.5}Sr_{0.5}TiO_3$ с электродами из Cu–Cr и из YBCO.

помощью жидкостной фотолитографии. Ширина зазоров, полученных таким способом, составляла $s = 5-10 \,\mu$ m, длина зазоров менялась в пределах $l = 0.1-2.5 \,\text{mm}$ (рис. 1). На одной подложке размером $10 \times 10 \,\text{mm}$ формировалось до 32 отдельных элементов.

В работе были проведены измерения температурных зависимостей емкости (*C*) и tg δ на частоте 1 MHz в интервале 78–300 K, а также измерения вольт-фарадных характеристик при 78 и 300 K в диапазоне напряжения — 150–150 V. Было изготовлено и измерено по ~ 30 структур с различным материалом электродов.

На температурных зависимостях погонной емкости планарных структур с металлическими электродами и с электродами из YBCO обнаружены широкие максимумы при T = 210-240 K (рис. 1) в области перехода сегнетопарафаза. Верхняя кривая, приведенная на рис. 1 для образцов с электродами из Cu–Cr, характерная для всех структур такого типа. Значения емкостей таких образцов различались не более чем на 10% во всем температурном диапазоне. Емкости структур с YBCO-электродами были всегда меньше, а разброс значений емкости для различных образцов таких структур был существенно больше, чем у структур с металлическими электродами. Две кривые, приведенные на рис. 1, ограничивают диапазон, в котором лежат значения емкости для структур YBCO/BST. Скорее всего, это связано с диффузией компонентов пленки YBCO в BST в результате технологического процесса.

Рис. 2 иллюстрирует влияние материала электродов на диэлектрический гистерезис [2]. На вольт-фарадных характеристиках структур с металлическими электродами диэлектрический гистерезис ($\Delta C/C_0, C_0$ начальное значение емкости) проявляется как в сегнето- (T = 78 K), так и в парафазе ($T = 300 \,\mathrm{K}$). Большинство ($\sim 80\%$) структур YBCO/BST не проявляют гистерезис в парафазе ($T = 300 \, \text{K}$) независимо от характера кривой C(T). Для образцов с ҮВСО-электродами диэлектрический гистерезис в сегнетофазе становится меньше ($T = 78 \, {\rm K}$) по сравнению с гистерезисом в сегнетофазе для структур Cu-Cr/BST. Наличие образцов YBCO/BST с гистерезисом в парафазе, вероятно, можно объяснить химическими процессами на границе раздела электрод-пленка [3]. Управляемость нелинейных конденсаторных структур удобно характеризовать коэффициентом $K = C_0 C(U_{\text{max}}) (U_{\text{max}} = |150V|)$ [4]. Следует отметить, что при 300 К управляемость структур YBCO/BST с безгистерезисными характеристиками сохранялась практически такой же (K = 1.34), как и для структкр Cu-Cr/BST (K = 1.43), если их температурная зависимость емкости соответствовала верхней кривой рис. 1. У образцов, температурная зависимость которых соответствовала нижней кривой (рис. 1), управляемость была значительно меньше (K = 1.15).

Тангенс угла диэлектрических потерь tg δ (рис. 3) структур с электродами из YBCO во всем температурном диапазоне меньше, чем tg δ образцов с металлическими электродами.

Сильное уширение максимумов C(T) для пленок Ba_{0.5}Sr_{0.5}TiO₃ уже обсуждалось нами в [1]; основными причинами широких максимумов



Рис. 2. Вольт-фарадные характеристики планарных структур с различным материалом электродов в сегнето- (T = 78 K) и в парафазе (T = 300 K).

могут быть неоднородность состава по толщине и по площади пленки, а также упругие напряжения в пленке. Изменение материала электродов оказывает незначительное влияние на ширину максимумов температурных зависимостей C(T). Наблюдаемое снижение емкости структур YBCO/BST, вероятно, связано с изменениями, происходящими в пленке



Рис. 3. Температурные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь для структур с электродами из Cu–Cr и из YBCO.

ВST как при нанесении YBCO-электрода, так и при последующем хранении [3], в частности имеет место химическое взаимодействие между слоями BST и YBCO [5]. При этом эффективная емкость всей структуры и соответствующая ей диэлектрическая проницаемость уменьшаются. Приближенная оценка диэлектрической проницаемости структур с металлическими электродами при рабочей температуре 300 К составляет $\varepsilon \cong 700$ [1], для структур с электродами из YBCO диэлектрическая проницаемость лежит в диапазоне $\varepsilon \cong 670-300$. Верхняя граница соответствует кривой 2, нижняя — кривой 3 (рис. 1).

Электроды из YBCO оказывают влияние на наличие диэлектрического гистерезиса как в пара, так и в сегнетофазе. В случае металлических электродов диэлектрический гистерезис структур на основе пленок

Ва_{0.5}Sr_{0.5}TiO₃ в парафазе (рис. 2, T = 300 K) можно объяснить, как и для SrTiO₃ [2]: 1) образованием объемного заряда на контакте маталл/сегнетоэлектрик; если, как обычно, работа выхода из металла ($\Phi_{\rm M}$) меньше работы выхода из сегнетоэлектрика ($\Phi_{\rm c3}$), то образуется барьер для дырок [6]; 2) инжекцией электронов из металлического электрода. Вольт-фарадные характеристики без диэлектрического гистерезиса наблюдались в структурах на основе монокристаллического SrTiO₃ с электродами из YBCO при 4.2 K (при этом $\Phi_{\rm YBCO} > \Phi_{\rm c3}$ [6]). При таком соотношении работ выхода инжекция носителей из электродов подавлена [7]и диэлектрический гистерезис отсутствует. Можно предположить, что в случае контакта YBCO/BST реализуется такое же соотношение работ выхода и диэлектрический гистерезис не наблюдается (рис. 2, T = 300 K).

При использовании электродов из YBCO диэлектрический гистерезис структур в сегнетофазе также становится меньше по сравнению с гистерезисом в сегнетофазе для структур с электродами из Cu–Cr (рис. 2, T = 78 K). Это можно объяснить тем, что гистерезис в структурах Cu–Cr/BST обусловлен не только сегнетоэлектрическим переходом, но и образованием и перераспределением объемного заряда. Переход YBCO в сверхпроводящую фазу, скорее всего, не оказывает влияния на характеристики структур при 78 K, так как работа выхода при этом не изменяется [5,8]; наши предыдущие эксперименты со структурами YBCO/STO (STO-монокристалл) показали, что корреляции между температурой сверхпроводящего перехода и наличием диэлектрического гистерезиса не наблюдается [6].

Снижение уровня диэлектрических потерь в структурах YBCO/BST по сравнению с потерями в структурах Cu–Cr/BST может быть связано с изменением свойств граничного слоя пленки BST.

Таким образом, использование электродов из YBCO в планарных структурах на основе тонких пленок $Ba_{0.5}Sr_{0.5}TiO_3$ обеспечивает отсутствие диэлектрического гистерезиса в параэлектрической фазе при сохранении диэлектрической нелинейности и к снижению уровня диэлектрических потерь.

Работа выполнена в рамках проектов по сверхпроводимости № 94051 и № 95014.

Список литературы

- [1] Гольцман Б.М., Дедык А.И., Леманов В.В., Тер-Мартиросян Л.Т., Карманенко С.Ф. // ФТТ. 1996. Т. 38. С. 2493–2501.
- [2] Вендик О.Г., Дедык А.И., Дмитриев Р.В. и др. // ФТТ. 1984. Т. 26. С. 684-689.
- [3] Дедык А.И., Карманенко С.Ф., Тер-Мартиросян Л.Т. // Электрическая ре-
- лаксация в высокоомных материалах. Тез. докл. С.-Петербург, 1994. С. 1373.
- [4] Сегнетоэлектрики в технике СВЧ / Под ред. О.Г. Вендика. М., 1979. 272 с.
- [5] Куприянов М.Ю., Лихарев К.К. // УФН. 1990. Т. 160. С. 49-56.
- [6] Dedyk A.L., Plotkina N.W., Ter-Martirosyan L.T. // Ferroelectrics. 1993. T. 144. C. 77–81.
- [7] Дедык А.И., Карманенко С.Ф., Малышев М.Н., Тер-Мартиросян Л.Т. // ФТТ. 1955. Т. 37. С. 3470–3475.
- [8] Шкуратов С.И., Месяц В.Т., Иванов С.Н. и др. / СФХТ. 1990. Т. 3. С. 1214– 1222.